

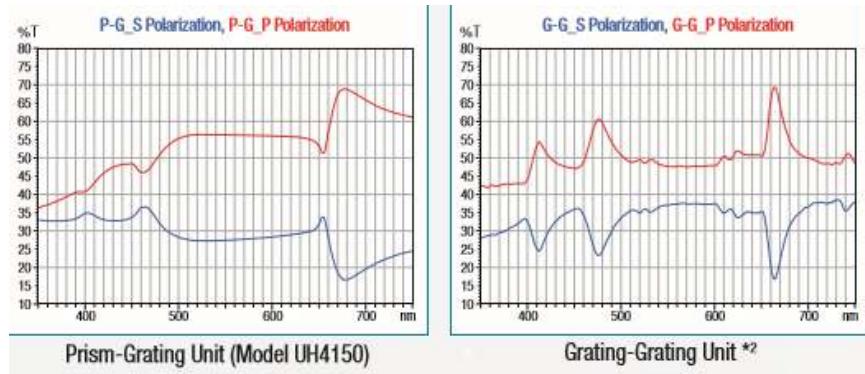
اسپکتروفوتومتر UV-Vis مدل UH4150

اسپکتروفوتومتر UV-Vis مدل UH4150 محصول شرکت Hitachi ژاپن می باشد . اسپکتروفوتومتر UV-Vis مدل UH4150 یکی از پیشرفته ترین محصولات اسپکتروفوتومتر UV-Vis است که انتظارات کاربران را برای اندازه گیری در فاز جامد برآورده ساخته و دارای پیشرفته ترین تجهیزات اندازه گیری است .

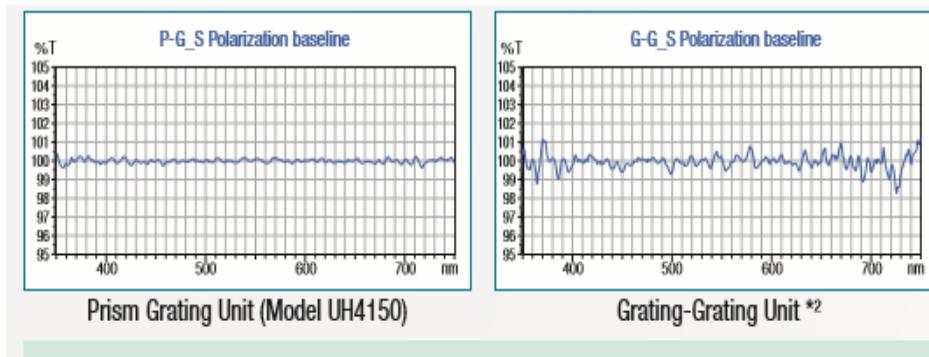


اسپکترومتر UV-Vis مدل UH4150 دارای سیستم اپتیکی پیشرفته ای است که حاوی منوکروماتور دوتایی و منشور در سیستم اپتیکی خود می باشد. اسپکتروسکوپی UV-Vis برای نمونه های جامد بسیار مناسب است. اسپکتروفوتومتر UV-Vis مدل UH4150 کمترین اثر پلاریزاسیون و کمترین میزان نویز را ارائه می دهد. این سیستم مجهز به دو کروماتور به همراه منشور است. تغییرات بزرگی در شدت نور پلاریزاسیون S و P برای سیستم منشور- گریت (P-G) کمتر از سیستم گریت - گریت (G-G) می باشد.

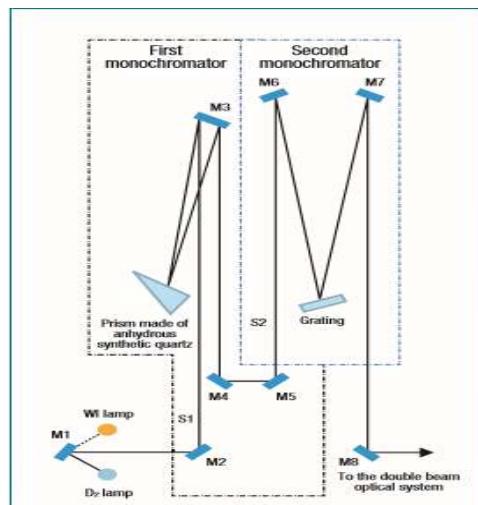
مقایسه کاراکترهای پلاریزاسیون در اسپکتروفوتومتر UV-Vis مدل UH4150



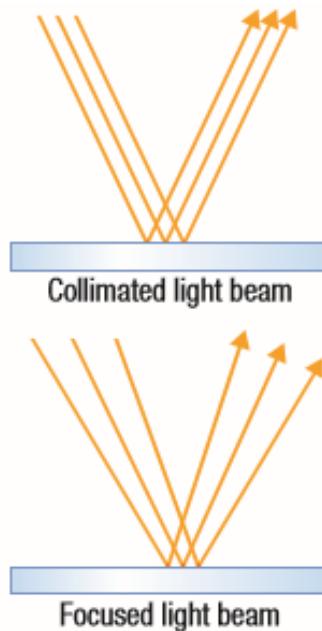
مقایسه بیس لاین پلاریزاسیون در اسپکتروفوتومتر UV-Vis مدل UH4150



با توجه به شکل های نشان داده شده در شکل بالا ، بیس لاین برای سیستم اپتیکی P-G به مراتب پایدارتری بیشتری نسبت به سیستم G-G را ارائه می دهد . علاوه بر این، کاهش شدید نور در سیستم P-G باعث کاهش نویز می شود.



اسپکتروفوتومتر UV-Vis مدل UH4150 دارای سیستم اندازه گیری دقیق بازتابی آینه ای و دارای سیستم پیشرفته موازی سازی پرتو است . زاویه برخورد برای اندازه گیری عددی چشمگیر نمونه های جامد مهم است. برای پرتو مت مرکز شده، زاویه برخورد بسته به طول کانونی لنز و غیره متفاوت است. در نتیجه، مقادیر شبیه سازی طراحی نوری، مانند فیلم های چند لایه ، دی الکتریک و منشور، با مقادیر واقعی اندازه گیری متفاوت است. با این حال، در مورد یک پرتو نوری موازی شده ، زاویه برخورد همیشه با توجه به نمونه یکسان است، که منجر به اندازه گیری بسیار دقیق انعکاس نور می شود. علاوه بر این، پرتو نور موازی شده برای ارزیابی نفوذ پذیری (حساس) و اندازه گیری انتقال لنز مفید است.



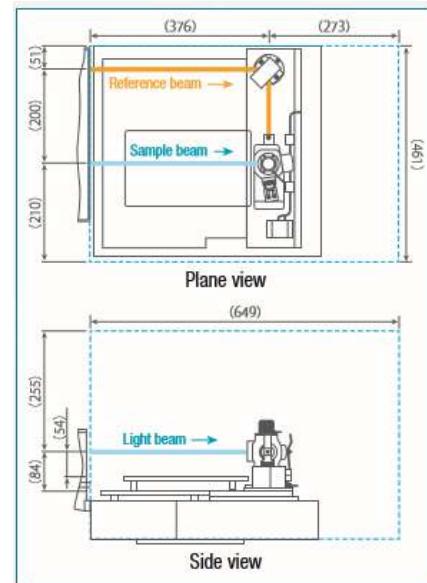
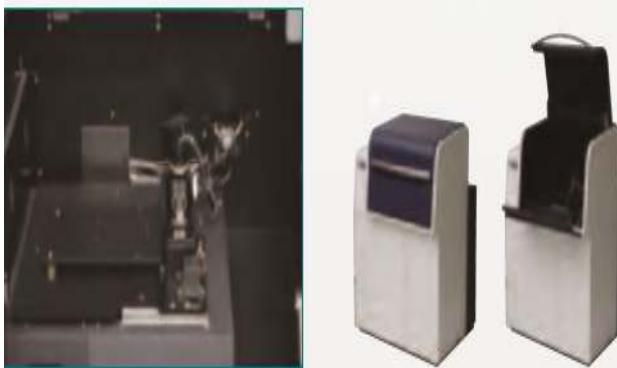
تفاوت در تعویض آشکارساز موجب کاهش سطح سیگنال در اسپکتروفوتومتر مرئی - فرابنفش مدل UH4150 می شود.

دقت بهبود یافته در منطقه طیفی نزدیک به مادون قرمز چندگانه و یکپارچه سازی کروی برای اندازه گیری در طیف گسترده ای از طول موج ها، از اشعه ماوراء بنفسن تا مرئی به مناطق نزدیک به مادون قرمز صورت می گیرد. تغییرات مقادیر فوتومتریک در تعویض آشکارساز (از تفاوت های سطح سیگنال) به دلیل طراحی تخصصی طیف سنجی مرئی فرابنفش مدل UH4150 پردازش سیگنال و غیره را، به حداقل می رساند.



محفظه بزرگ نمونه در اسپکتروفتوومتر UV-Vis مدل UH4150

یکی از ویژگی های منحصر به فرد اسپکتروفتوومتر UV-Vis مدل UH4150 داشتن محفظه بزرگ برای نمونه به اندازه $680 \times 470 \times 300$ (W) mm می باشد . این ویژگی موجب جایگزینی مناسب برای نمونه های نمونه جامد شده است. در اسپکتروفتوومتر UV-Vis مدل UH4150 قابلیت دستیابی به نمونه های بزرگ، انعطاف پذیری در استفاده از لوازم جانبی و بهبود عملکرد ظرفیت محفظه نمونه حدود دو برابر نسبت به مدل محفوظه نمونه استاندارد U-4100 است. نمونه هایی از قبیل ورق شیشه ای و مصالح ساختمانی می توانند غیر مخرب (حداکثر اندازه نمونه 430 میلیمتر) باشند. علاوه بر این، لوازم جانبی وسیع حاوی اجزای متحرک، مانند جفت متغیر زاویه ای مطلوب، می توانند نصب شود.

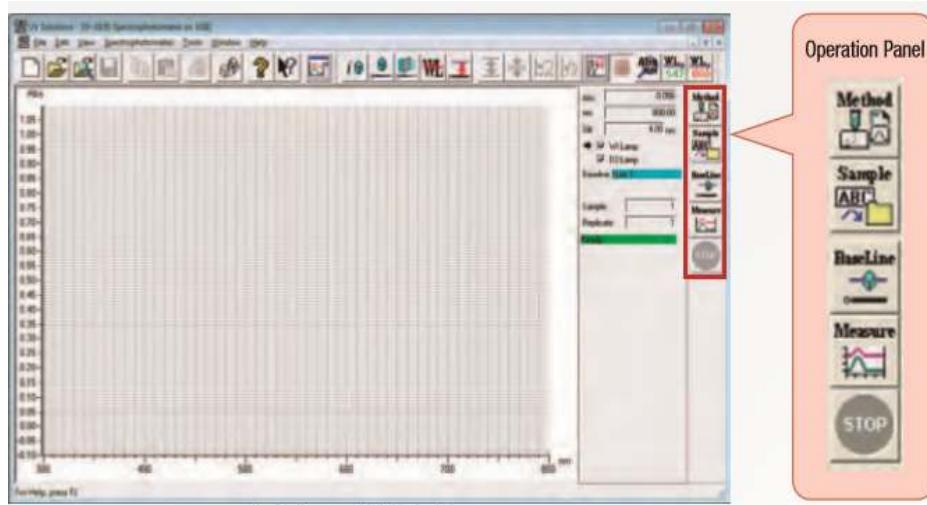


سازگاری اسپکتروفوتومتر UV-Vis مدل UH4150

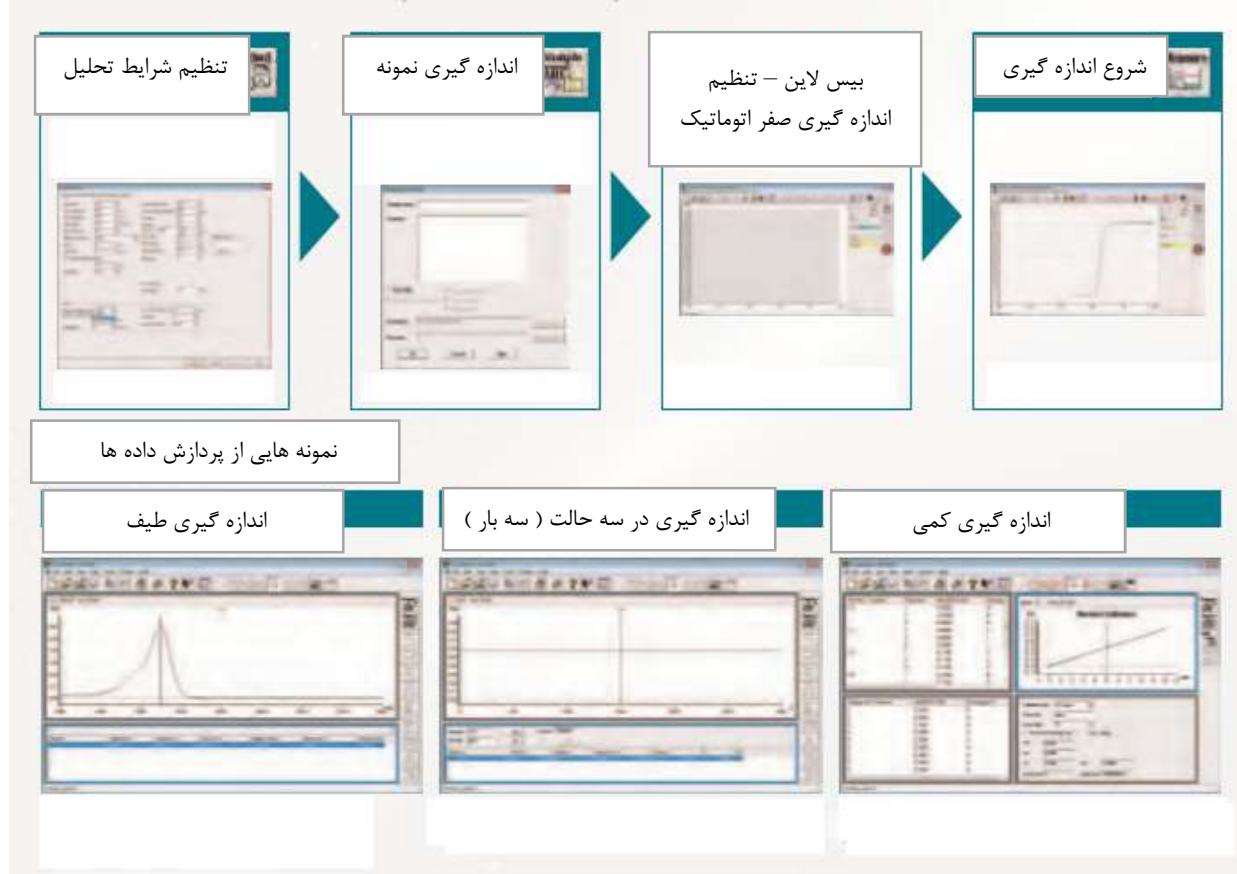
لوازم جانبی مورد استفاده با مدل U-4100 همچنین می تواند با مدل 3 * UH4150 استفاده شود. از آنجا که لوازم جانبی قابل جابجایی هستند، آنها به تطبیق طیف گستره ای از انواع اندازه گیری کمک می کنند. برای جزئیات لوازم جانبی، لطفا بروشور لوازم جانبی را ببینید.



نرم افزار اسپکتروفوتومتر UV-Vis مدل UH4150 نرم افزار UV Solutions نسخه 4.2 است که حاوی رابط کاربری می باشد. این نرم افزار توانایی اندازه گیری را تحت پارامتر های یکسان را دارا می باشد . اسپکتروفوتومتر UV-Vis مدل UH4150 دارای نرم افزار کاربر پسند بوده که به آسانی قابل استفاده می باشد . دکمه های عملیاتی اندازه گیری در سمت راست اسپکتروسکوپی - UV Vis مدل UH4150 تنظیم شده اند. برای تکمیل اندازه گیری، چهار عملیات اساسی وجود دارد.



نرم افزار اسپکتروفتوومتر UV-Vis مدل UH4150



ویژگی های اسپکتروفوتومتر UV-Vis مدل UH4150

- تفاوت های سطح سیگنال کوچک در سوئیچ آشکارساز، اندازه گیری بسیار دقیق را حتی زمانی که طول موج آشکارساز در حال تغییر است، تحمل می کند. تفاوت های سطح سیگنال کوچک در سوئیچ آشکارساز، اندازه گیری بسیار دقیق را حتی زمانی که طول موج آشکارساز در حال تغییر است، متتحمل می شود .
- نور منبع کم و ویژگی های قطبیش کم با عملکرد منحصر به فرد عملکرد منحنی هیتاچی سیتم پرتو نور متصل شده، پراکنده‌گی دقیق پرتو نور را اندازه گیری می کند.
- طیف گستره ای از آشکارسازها امکان انتخاب آشکارساز مناسب برای اهداف اندازه گیری را می دهد.
- طراحی ارگonomیک جدید
- سازگاری با لوازم جانبی
- بیشترین بازدهی

مشخصات فنی اسپکتروفوتومتر UV-Vis مدل UH4150

مشخصه	توضیح
اشکارساز اسپکتروفوتومتر UV-Vis	Integrating sphere detection system *1 Standard Integrating Sphere (inner coating: BaSO ₄) •60 mm Standard Integrating Sphere (4-port type) : Incident angle on reflective sample: Sample side: 8°, reference side: 0° •60 mm Standard Integrating Sphere (4-port type) : Incident angle on reflective sample: Sample side and reference side: 10° •60 mm Standard Full Integrating Sphere (2-port type)
محدوده تنظیم طول موج اسپکترومتر UV-Vis	175 - 3,300 nm
محدوده اندازه گیری طول موج اسپکتروسکوپی UV-Vis	Direct light detection system 185 - 3,300 nm Integrating sphere detection system *1Item 240 - 2,600 nm 190 - 2,600 nm
منوکروماتور اسپکتروسکوپی UV-Vis	Prism-Grating, Double monochromator, Pre-monochromator: Littrow monochromator using a prism, Main monochromator: Czerny-Turner monochromator using Diffraction grating (2 switchable diffraction gratings)
محفظه نمونه اسپکتروفوتومتر UV-Vis	Sample compartment located on the table top and constructed to allow large samples Interior dimensions: 680 (W) × 470 (D) × 300 (H) mm, Light beam path length: 200 mm
شناسایر طول موج اسپکترومتر UV-Vis	In units of 0.01 nm
شناسایر پهنای slit اسپکتروسکوپی UV-Vis	UV and visible regions: Automatic control, and selection of a slit width from 0.01 to 2.4 nm in increments of 0.01 nm and from 2.4 to 8.0 nm in increments of 0.02 nm Near infrared region: Automatic control, and selection of a slit width from 0.1 to 20.0 nm in increments of 0.1 nm
دقت طول موج طیف سنجی مرئی - فرابنفش	UV and visible regions: ± 0.2 nm, Near infrared region: ± 1.0 nm, Automatic wavelength calibration function is incorporated
تنظیمات تکرار پذیری اسپکتروفوتومتر UV-Vis	UV and visible regions: ± 0.1 nm, Near infrared region: ± 0.5 nm
سرعت اسکن طول موج اسپکترومتر UV-Vis	Visible region: 0.3, 3, 15, 30, 60, 120, 300, 600, 1,200, and 2,400; Near infrared region: 0.75, 7.5, 37.5, 75, 150, 300, 750, 1,200, 1,500, 3,000, and 6,000 Go to λ: 3,600 nm/min (9,000 nm/min for near infrared region)
منبع نور اسپکتروفوتومتر UV-Vis	UV region: Deuterium lamp (mountable by one touch), Visible and near infrared regions: 50 W Tungsten-halogen lamp (long life of 1,000 hours)
سیستم سوییچینگ منبع نور اسپکترومتر UV-Vis	Automatic switching at a specified wavelength between 325 nm to 370 nm
متد فوتومتریک اسپکتروسکوپی UV-Vis	Double beam direct ratio photometry (Measurement of negative absorbance or transmittance/reflectance of more than 100% is possible owing to Hitachi-original differential feedback method) UV and visible regions: Negative voltage control method and slit control method; Near infrared region: slit control method and fixed slit method
حال فوتومتریک اسپکتروفوتومتر UV-Vis	Absorbance (Abs), transmittance (%T), reflectance (%R), reference side energy (E(R))/sample side energy (E(S))
محدوده فوتومتریک اسپکترومتر UV-Vis	Absorbance: -2 to +5.0 (in units of 0.001 Abs); Transmittance/reflectance: 0 - 999.99 (in units of 0.01%)
دقت فوتومتریک اسپکتروسکوپی UV-Vis	Certified according to NIST SRM 930: ± 0.002 Abs (0 - 0.5 Abs), ± 0.004 Abs (0.5 - 1.0 Abs), ± 0.3%
تکرارپذیری فوتومتریک اسپکتروفوتومتر UV-Vis	Certified according to NIST SRM 930: ± 0.001 Abs (0 - 0.5 Abs), ± 0.002 Abs (0.5 - 1.0 Abs), ± 0.1%T
مدت زمان واکنش اسپکترومتر UV-Vis	

An optimum response is automatically selected under given slit width and wavelength scan-speed.			
Less than ± 0.002 Abs (240 - 850 nm, slit width: 4 nm, scan speed: 300 nm/min)	Less than $\pm 2.0\%$ T (190 - 195 nm, slit width: 5 nm, scan speed: 300 nm/min) Less than $\pm 0.5\%$ T (195 - 850 nm, slit width: 5 nm, scan speed: 300 nm/min)	Less than ± 0.05 Abs (185 - 200 nm, slit width: 2 nm, scan speed: 300 nm/min) Less than ± 0.001 Abs (200 - 850 nm, slit width: 2 nm, scan speed: 300 nm/min)	تحصیل بیس لاین - اسپکتروسکوپی UV-Vis
Less than ± 0.002 Abs (850 - 2,200 nm, automatic slit width, scan speed: 750 nm/min, PbS sensitivity: 1)	Less than $\pm 0.5\%$ T (850 - 2,600 nm, automatic slit width, scan speed: 750 nm/min, PbS sensitivity: 1)	Less than ± 0.002 Abs (850 - 2,500 nm, automatic slit width, scan speed: 750 nm/min, PbS sensitivity: 1)	
Less than ± 0.004 Abs (2,200 - 2,600 nm, automatic slit width, scan speed: 750 nm/min. PbS sensitivity: 1)		Less than ± 0.004 Abs (2,500 - 3,300 nm, automatic slit width, scan speed: 750 nm/min. PbS sensitivity: 1)	
Two hours later after power-On: Less than 0.0004 Abs/ 60 minutes (340 nm)			سطح نویز اسپکتروفوتومتر UV-Vis
PC: OS; Windows® 7 Professional (32 bit or 64 bit)			پایداری بیس لاین اسپکتروفوتومتر UV-Vis
15 - 35°C			واحد پردازش داده ها اسپکتروفوتومتر UV-Vis
25 - 80% (No condensing, 70% or less under temperatures of 30°C or higher)			دمای عملکرد اسپکتروفوتومتر UV-Vis
900 (W) \times 760 (D) \times 1,180 (H) mm, 160 kg			روطیت قبل اجرا اسپکتروفوتومتر UV-Vis
			ابعاد فیزیکی - وزن اسپکتروفوتومتر UV-Vis